

Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии Х



Цена:

Цена по запросу

Описание

Полуавтоматические зондовые станции серии X

Полуавтоматические зондовые станции серии X предназначены для тестирования пластин диаметром до 300 мм, позволяют проводить измерения при температурах от -60 °C до 300 °C. Возможность управления зондовой станцией с помощью команд SCPI позволяет автоматизировать процесс измерений и минимизировать человеческий фактор при выполнении измерений Достоинства моделей серии X:

- · Тестирование светодиодов/фотодиодов/лазерных диодов (интенсивность излучения/длина волны)
- · Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик тестируемых материалов/изделий
- · СВЧ измерения (до 300 ГГц)
- · Измерения в широком диапазоне температур
- · Скорость перемещения держателя подложек до 70 мм/с

| Модель | | X6/X8/X12 |
|---|----------------------------|---|
| Держатель подложек | Диапазон перемещения ХҮ | 350mm*365mm |
| | Разрешение XY | 0.1мкм |
| | Повторяемость XY | ≦±1мкм |
| | Скорость перемещения ХҮ | ≦70 мм/с |
| | Z Диапазон перемещения | 20мм |
| | Z Разрешение | 0.1мкм |
| | Z Повторяемость | ≦±1мкм |
| | Z Скорость перемещения | ≦20 мм/с |
| Температурный диапазон | Диапазон | -60°C-300°C |
| | Стабильность | 0.1°C |
| | Разрешение | 0.01°C |
| Оптическая система с многократным увеличением | | Микроскоп с трехскоростным увеличением 15:1, может одновременно показывать изображения с низким, средним и высоким увеличением, легко наводить иглу |

| Широкое применение | Поддержка тестирования SiC/GaN пластин, тестирование мощных пластин Сменная конструкция держателя пластин для тестирования различных пластин |
|--------------------------------------|--|
| | ① Поддержка полуавтоматического управления (возможен ручной тест или переход на автоматический) |
| | ② Автоматическое выравнивание пластин |
| | ③ Автоматическое измерение размера матрицы |
| | Ф Автоматическое картированиепластин и удаленный доступ к данным |
| | © Свободное управление и программирование входных и выходных параметров |
| Функции программного обеспечения | © Быстрая интеграция нескольких тестеров |
| Tymique not parameter of occur terms | Э Автоматическая радиочастотная калибровка одной кнопкой, функция автоматической очистки иглы |
| | ®Поддержка тестирования по одной точке и непрерывного тестирования |
| | |
| | ®Классификация результатовтестирования и отображение их разнымцветом на карте пластин |
| | Контроль предельной скорости и блокировка безопасности |
| | |